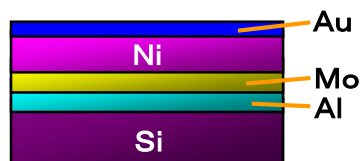
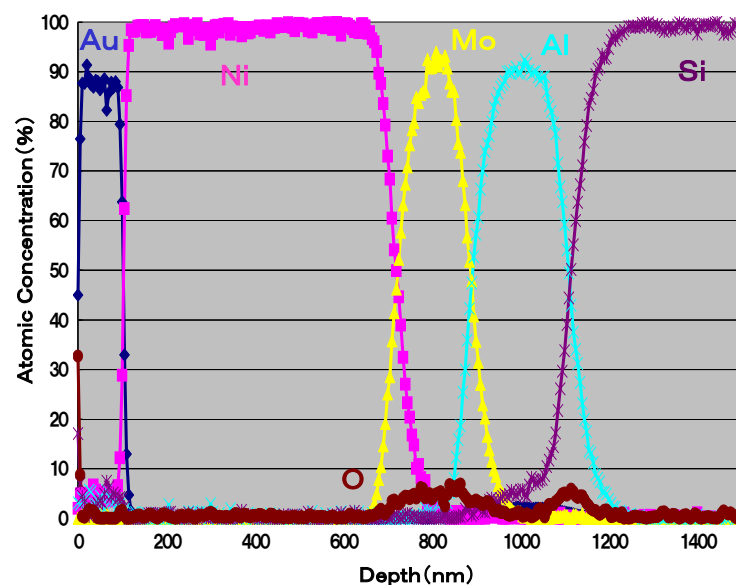


金属積層膜のXPS分析



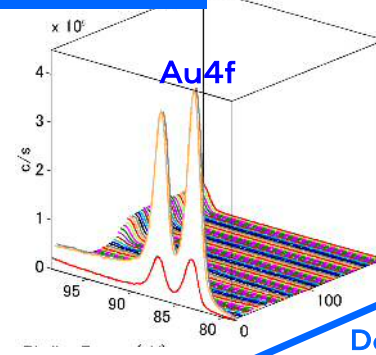
試料断面構造



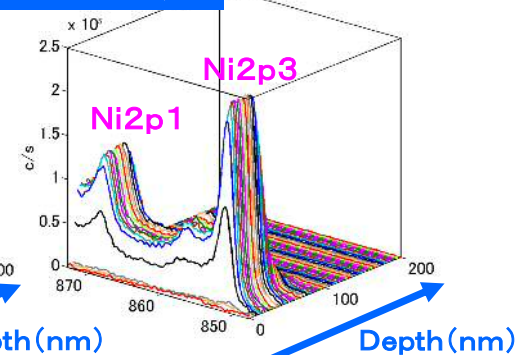
金属積層膜のデプスプロファイル(SiO_2 換算)

- デプスプロファイル
深さ方向への元素の濃度変化を検証
- ナロースペクトル多重表示
深さ方向への状態変化も検証可能

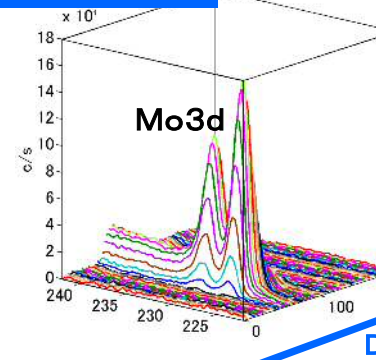
Auスペクトル表示



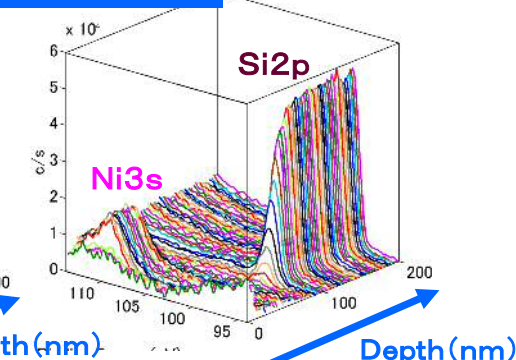
Niスペクトル表示



Moスペクトル表示



Siスペクトル表示



ナロースペクトル多重表示

金属積層膜のTOF-SIMS分析



TOFSIMSは最表面分析法の一つで、金属化合物の状態や有機化合物の推定が可能。
また、スパッタガンを用いることでDepth Profiling（深さ方向分析）が可能となり、金属の多層構造の状態評価等に用いられる。

■分析アプリケーション

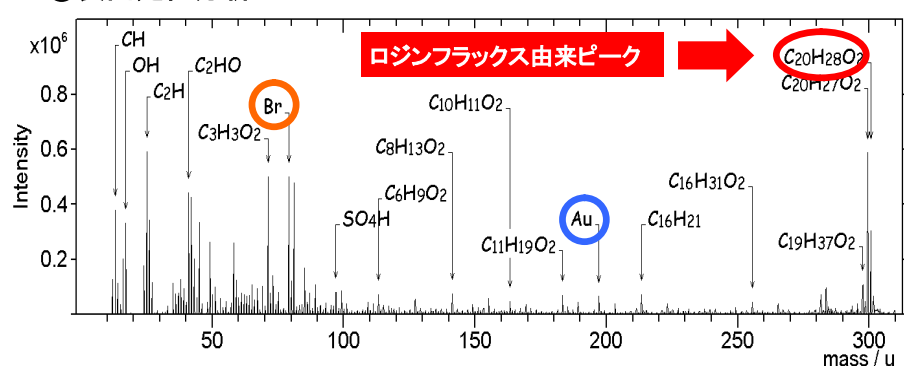
①表面定性分析

②表面イメージング

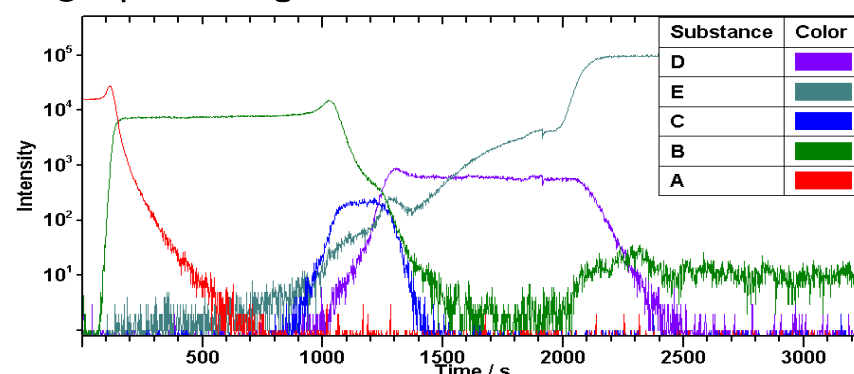
③Depth Profiling（深さ方向分析）

④断面Depthイメージング

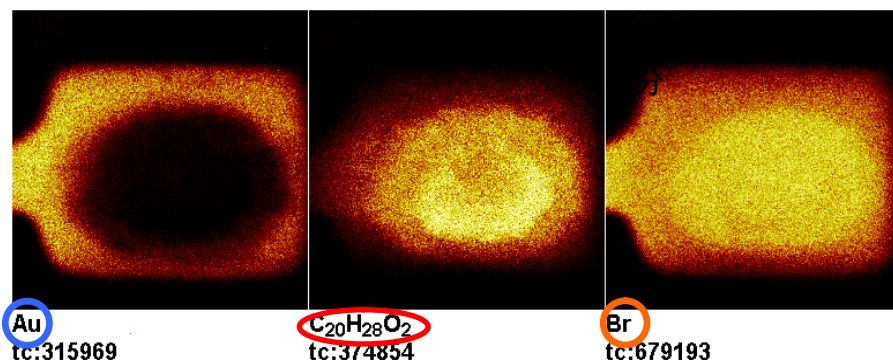
①表面定性分析（例）Auめっき上し部分分析



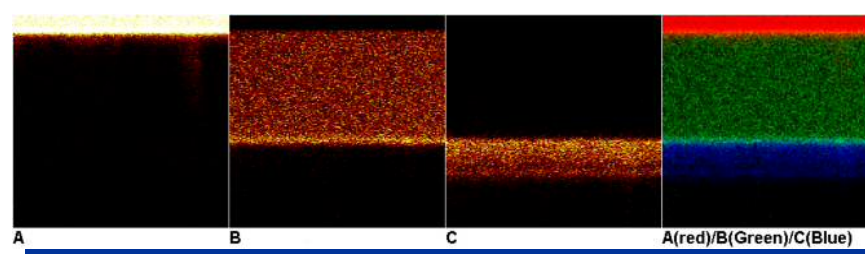
③Depth Profiling（例）金属の多層構造評価



②表面イメージング（例）Auめっき上し部分分析



④断面Depthイメージング（例）金属の多層構造評価



イメージ像 → 各成分の位置情報（表面・深さ方向分布）を視覚的に表示